

Short description

ICS 105型集成电路扫描仪，可对集成电路和小型组件进行高频近场测量。根据使用的探头情况，可在(50x50x50) mm的空间范围内对磁场或电场进行测量，并在电脑上显示测量结果。此外，探头可自动旋转以确定磁场的准确方向。可单独订购的ICR型近场微探头适用于1.5MHz至6GHz频率范围内的测量，空间分辨率可达50μm。

This basic version does not include the ChipScan-Scanner application software.
The system is controlled exclusively via the included Langer SDK (Windows & Linux).

Delivery content

- 1x ICS 105
- 1x UH DUT set
- 1x SH 01
- 1x ICS DM-CAM, SMA
- 1x GND mount
- 1x DM-CAM holder.3 SMA, SMA
- 1x ICS Flight case
- 1x ICS 105 m

Technical parameters

电源电压	110 / 230 V
接口	USB
最大过程路径	(50 x 50 x 50) mm; α -Rotation $\pm 180^\circ$
最小过程路径	(10 x 10 x 10) μ m; α -Rotation 1°
移动速度	(10 x 10 x 5) mm/s; α -Rotation $90^\circ/s$
重量	23 kg
尺寸(L x W x H)	(350 x 400 x 420) mm